

# Surfscan® SP A2/A3

비패턴 웨이퍼 검사 시스템은 반도체 칩의 수율과 신뢰성에 영향을 미치는 광범위한 중대 결함 및 표면 품질 문제를 검출해 냅니다.

## 혜택 :

Surfscan SP A2 및 SP A3는 고감도와 높은 처리량으로 중대한 결함을 검출하여 반도체 칩, 웨이퍼 및 장비 제조업체의 공정 및 공정 설비 검증 및 모니터링을 지원하며 이는 자동차 반도체 칩 제조업체에 크게 기여합니다.

- R&D 및 양산 과정에서 반도체 칩 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 결함 원인을 제거함으로써 제로 결함 요구 사항을 달성하고 있습니다.
- 공정 설비 결함의 원인을 해결하는 지속적인 개선 프로그램을 구현하여 모든 공정 설비가 자동차 신뢰성 목표 달성에 필요한 표준을 확실히 충족시킵니다
- 자동차 워크 플로우에 사용하기 위한 최고의 성능을 내는 공정 설비를 식별합니다.

## 기술 :

- DUV 레이저 광원 및 DUV 최적화 광학계
- 동시 작동이 가능한 표준 암시야 및 선택적 명시야 검사 모드
- 자동화된 결함 및 결함 특징 분류
- 고급 알고리즘 및 이미지 컴퓨터
- SURFmonitor™ 표면 품질 측정 및 특성화 모듈
- SurfServer® 설비군 및 레시피 관리

## 응용 :

- 입출고 웨이퍼 품질 관리
- 양산에서 재료, 화학 물질, 공정 및 공정 설비의 검증 및 모니터링
- R&D 중 공정 특성화, 디버그 및 검증



## 시장 :

다음에 포함한 여러 반도체 제조 부문 :

- 자동차, IoT, 5G, 가전 제품, 산업(군사, 항공 우주, 의료)을 위한 더 큰 설계 노드 소자의 반도체 칩 제조
- 웨이퍼 제조
- 반도체 장비 및 재료/화학 제품 제조

## 플랫폼 :

- 맞춤형 구성

## 웨이퍼 크기 :

- Surfscan SP A3: 300mm
- Surfscan SP A2: 200mm, 150mm

## 추가 정보 :

[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2)